

Wafer-Inspektionsanlage

Wenn mit blossem Auge die zu prüfenden Elemente nicht mehr erkennbar sind, werden hohe Ansprüche an die Prüfsoftware gestellt.

Axetris betreibt Wafer-Inspektionssysteme mit National Instruments LabVIEW. Nach mehreren Betriebsjahren sollte die Software überarbeitet werden. Die MEquadrat AG wurde mit der Aufgabe betraut, eine neue Inspektionssoftware zu erstellen, die vor allem in den Bereichen Bedienbarkeit und Performance Verbesserungen bieten sollte, sowie zusätzliche Funktionen und Hardwarekomponenten integriert.

Zusammen mit dem Kunden wurden der Funktionsumfang der bestehenden Software sowie die zusätzlichen Anforderungen erfasst. Basierend auf dem daraus erstellen Pflichtenheft wurde mit der Implementierung der neuen Software begonnen.

Laufende Kontrolle der Funktionalität an einem vom Kunden zur Verfügung gestellten Testplatz gewährleistete die Qualität der Software während der gesamten Entwicklung.

Durch die neue Inspektionssoftware und der darin integrierten neuen Funktionalitäten können die Produktionsmitarbeiter von Axetris die Prüfungen effizienter durchführen.

Die neue Artikelkonfiguration erlaubt es den Produktverantwortlichen, die Anlage optimal auf den jeweiligen Artikel einzustellen und die Inspektionsparameter festzulegen. Aufgrund der unterschiedlichen Varianten zur Aufspannung des Wafer sind umfangreiche Ausrichtungs- und Skalierungsalgorithmen implementiert worden.

Aufgrund der Flexibilität der objektorientierten Programmierung ist es möglich, zusätzliche Inspektionsmodi oder andere Hardwarekomponenten einzubinden, ohne den Kern der Software zu verändern.

